

Skenovací elektronový mikroskop

Popis/ Parametry

Skenovací elektronový mikroskop Tescan Vega s detektory sekundárních elektronů (SE), zpětně odražených elektronů (BSE) a energiově disperzní spektroskopii (EDS) vhodný pro analýzu různých druhů materiálů - anorganické, organické a biologické suché vzorky, metalurgické a geologické materiály v práškové i tvarované formě. Maximální velikost vzorku: 40 x 40 mm (šířka x výška). Možnost náklonu vzorku (72°) a rotace (360°). Pro nevodivé materiály se před analýzou provádí pokovení zlatem (Quorum Q150R ES plus).

Využití/ Služby

- Analýza mikrostruktury vzorků
- Analýza chemického složení (bodové, liniové a plošné prvkové mapování)

